Документ полтисан простой алектронной полтиство НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректо **Редеральное** государственное автономное образовательное учреждение Дата подписания: 27.10.2023 12:14:45 высшего образования

Уникальный про**«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»** d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

# Рабочая программа дисциплины (модуля)

# **Метрология, стандартизация и технические** измерения в электронике

Закреплена за подразделением Кафедра материаловедения полупроводников и диэлектриков

Направление подготовки 22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Профиль

Квалификация Инженер-исследователь

 Форма обучения
 очная

 Общая трудоемкость
 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану 144 Формы контроля в семестрах:

в том числе: зачет с оценкой 6

 аудиторные занятия
 51

 самостоятельная работа
 93

# Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	6 (3.2)		Итого		
Недель	1	8			
Вид занятий	УП	УП РП		РΠ	
Лабораторные	17 17		17	17	
Практические	34	34	34	34	
Итого ауд.	51	51 51 51 51			
Контактная работа	51	51	51 51		
Сам. работа	93 93		93	93	
Итого	144	144	144	144	

Программу составил(и): *ст.преп., Гореева Ж.А.* 

Рабочая программа

Метрология, стандартизация и технические измерения в электронике

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» по направлению подготовки 22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ (приказ от 28.06.2023 г. № 292 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ, 22.03.01-БМТМ-23\_6-ПП.plx , утвержденного Ученым советом НИТУ МИСИС в составе соответствующей ОПОП ВО 22.06.2023, протокол № 5-23

Утверждена в составе ОПОП ВО:

22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ, , утвержденной Ученым советом НИТУ МИСИС 22.06.2023, протокол № 5-23

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра материаловедения полупроводников и диэлектриков

Протокол от 21.06.2023 г., №12-22/23

Руководитель подразделения Оганов А.Р.

# 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Сформировать компетенции в соответствии с учебным планом в области метрологии, стандартизации и технических измерений применительно к материалам и изделиям электронной техники

Блок ОП: Б1.В.ДВ.03  2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:  2.1.1 Введение в квантовую теорию твердого тела  2.1.2 Дефекты кристаллической решетки  2.1.3 Компьютеризация эксперимента  2.1.4 Материалы альтернативной энергетики  2.1.5 Материалы наукоемких технологий  2.1.6 Основы дизайна металлических материалов  2.1.7 Планирование и организация научно-исследовательской работы  2.1.8 Планирование научного эксперимента  2.1.9 Современные проблемы материаловедения  2.1.10 Теория поверхностных явлений  2.1.11 Теория симметрии  2.1.12 Электроника  2.1.13 Кристаллография	
2.1       Требования к предварительной подготовке обучающегося:         2.1.1       Введение в квантовую теорию твердого тела         2.1.2       Дефекты кристаллической решетки         2.1.3       Компьютеризация эксперимента         2.1.4       Материалы альтернативной энергетики         2.1.5       Материалы наукоемких технологий         2.1.6       Основы дизайна металлических материалов         2.1.7       Планирование и организация научно-исследовательской работы         2.1.8       Планирование научного эксперимента         2.1.9       Современные проблемы материаловедения         2.1.10       Теория поверхностных явлений         2.1.11       Теория симметрии         2.1.12       Электроника         2.1.13       Кристаллография	
2.1.1       Введение в квантовую теорию твердого тела         2.1.2       Дефекты кристаллической решетки         2.1.3       Компьютеризация эксперимента         2.1.4       Материалы альтернативной энергетики         2.1.5       Материалы наукоемких технологий         2.1.6       Основы дизайна металлических материалов         2.1.7       Планирование и организация научно-исследовательской работы         2.1.8       Планирование научного эксперимента         2.1.9       Современные проблемы материаловедения         2.1.10       Теория поверхностных явлений         2.1.11       Теория симметрии         2.1.12       Электроника         2.1.13       Кристаллография	
2.1.2       Дефекты кристаллической решетки         2.1.3       Компьютеризация эксперимента         2.1.4       Материалы альтернативной энергетики         2.1.5       Материалы наукоемких технологий         2.1.6       Основы дизайна металлических материалов         2.1.7       Планирование и организация научно-исследовательской работы         2.1.8       Планирование научного эксперимента         2.1.9       Современные проблемы материаловедения         2.1.10       Теория поверхностных явлений         2.1.11       Теория симметрии         2.1.12       Электроника         2.1.13       Кристаллография	
2.1.3       Компьютеризация эксперимента         2.1.4       Материалы альтернативной энергетики         2.1.5       Материалы наукоемких технологий         2.1.6       Основы дизайна металлических материалов         2.1.7       Планирование и организация научно-исследовательской работы         2.1.8       Планирование научного эксперимента         2.1.9       Современные проблемы материаловедения         2.1.10       Теория поверхностных явлений         2.1.11       Теория симметрии         2.1.12       Электроника         2.1.13       Кристаллография	
2.1.4       Материалы альтернативной энергетики         2.1.5       Материалы наукоемких технологий         2.1.6       Основы дизайна металлических материалов         2.1.7       Планирование и организация научно-исследовательской работы         2.1.8       Планирование научного эксперимента         2.1.9       Современные проблемы материаловедения         2.1.10       Теория поверхностных явлений         2.1.11       Теория симметрии         2.1.12       Электроника         2.1.13       Кристаллография	
2.1.5       Материалы наукоемких технологий         2.1.6       Основы дизайна металлических материалов         2.1.7       Планирование и организация научно-исследовательской работы         2.1.8       Планирование научного эксперимента         2.1.9       Современные проблемы материаловедения         2.1.10       Теория поверхностных явлений         2.1.11       Теория симметрии         2.1.12       Электроника         2.1.13       Кристаллография	
2.1.6       Основы дизайна металлических материалов         2.1.7       Планирование и организация научно-исследовательской работы         2.1.8       Планирование научного эксперимента         2.1.9       Современные проблемы материаловедения         2.1.10       Теория поверхностных явлений         2.1.11       Теория симметрии         2.1.12       Электроника         2.1.13       Кристаллография	
2.1.7       Планирование и организация научно-исследовательской работы         2.1.8       Планирование научного эксперимента         2.1.9       Современные проблемы материаловедения         2.1.10       Теория поверхностных явлений         2.1.11       Теория симметрии         2.1.12       Электроника         2.1.13       Кристаллография	
2.1.8       Планирование научного эксперимента         2.1.9       Современные проблемы материаловедения         2.1.10       Теория поверхностных явлений         2.1.11       Теория симметрии         2.1.12       Электроника         2.1.13       Кристаллография	
2.1.9       Современные проблемы материаловедения         2.1.10       Теория поверхностных явлений         2.1.11       Теория симметрии         2.1.12       Электроника         2.1.13       Кристаллография	
2.1.10       Теория поверхностных явлений         2.1.11       Теория симметрии         2.1.12       Электроника         2.1.13       Кристаллография	
2.1.11       Теория симметрии         2.1.12       Электроника         2.1.13       Кристаллография	
2.1.12       Электроника         2.1.13       Кристаллография	
2.1.13 Кристаллография	
2.1.14 Безопасность жизнедеятельности	
2.1.15 Инженерная и компьютерная графика	
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модул предшествующее:	ія) необходимо как
2.2.1 Атомное строение фаз	
2.2.2 Биохимия наноматериалов	
2.2.3 Инженерия поверхности	
2.2.4 Металловедение и термическая обработка металлов	
2.2.5 Методы исследования структур и материалов. Часть 1	
2.2.6 Методы исследования физических свойств полупроводниковых структур	
2.2.7 Наноматериалы	
2.2.8 Научно-исследовательская работа	
2.2.9 Научно-исследовательская работа	
2.2.10 Научно-исследовательская работа	
2.2.11 Научно-исследовательская работа	
2.2.12 Сверхтвердые материалы	
2.2.13 Технологии материалов с особыми физическими свойствами	
2.2.14 Фазовые и структурные изменения при формировании материалов и эпитаксиальных структурные изменения при формировании материалов и объектиров и объе	 ктур
2.2.15 Физика магнитных явлений	71
2.2.16 Физика полупроводниковых приборов	
2.2.17 Физика прочности	
2.2.18 Физика прочности и механические свойства материалов	
2.2.19 Физико-химия металлов и неметаллических материалов	
2.2.20 Физические основы деформации и разрушения	
2.2.21 Атомная и электронная структура поверхности и межфазных границ	
2.2.22 Композиционные материалы	
2.2.23 Конструирование композиционных материалов	
2.2.24 Методы исследования структур и материалов. Часть 2	
2.2.25 Поверхностное модифицирование материалов и защитные покрытия	
2.2.26 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональных	нальной деятельности
2.2.27 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональных	
2.2.28 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональных	
2.2.29 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональных	

2.2.30	Спочноти чило опторы
2.2.30	Специальные сплавы  Физическое материаловедение сплавов с особыми магнитными свойствами, часть 1. Магнитно-мягкие сплавы
2.2.31	Физическое материаловедение сплавов с особыми магнитными свойствами, часть 1. Магнитно-мягкие сплавы  Физическое материаловедение сплавов с особыми магнитными свойствами, часть 2. Магнитно-твердые сплавы
2.2.32	•
2.2.33	Аморфные, микро- и нанокристаллические материалы
	Биофизика
2.2.35	Высокотемпературные и сверхтвердые функциональные и конструкционные материалы
2.2.36	Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве
2.2.37	Материаловедение и технологии перспективных материалов
2.2.38	Методы исследования характеристик и свойств материалов
2.2.39	Методы электронной микроскопии для материалов твердотельной электроники
2.2.40	Метрология и испытания функциональных материалов
2.2.41	Основы научно-технического перевода
2.2.42	Практика научно-технического перевода и редактирования
2.2.43	Тензорные методы в кристаллофизике
2.2.44	Технология получения кристаллов
2.2.45	Физические основы магнетизма и процессы перемагничивания материалов
2.2.46	Физические свойства приповерхностных слоев и методы их исследований
2.2.47	Функциональные наноматериалы
2.2.48	Химия и технология полимерных материалов
2.2.49	Биоорганическая химия
2.2.50	Высокотемпературные керамические материалы
2.2.51	Жаропрочные и радиационно-стойкие материалы
2.2.52	Квантовая теория твердого тела
2.2.53	Математическое и компьютерное моделирование материалов и процессов электроники
2.2.54	Методы исследования макро- и микроструктуры материалов
2.2.55	Методы непараметрической статистики
2.2.56	Некоторые главы кристаллохимии
2.2.57	Объемные наноматериалы
2.2.58	Процессы получения и обработки сверхтвердых материалов
2.2.59	Структура и технологичность сплавов
2.2.60	Физико-химия эволюции твердого вещества
2.2.61	Ядерно-спектроскопические и синхротронные методы исследований
2.2.62	Аттестация и испытания высокотемпературных и сверхтвердых материалов
2.2.63	Аттестация и сертификация изделий электронной техники
2.2.64	Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве функциональных материалов
2.2.65	Материаловедение и технологии перспективных материалов
2.2.66	Материалы и элементы спинтроники и спинволновой оптики
2.2.67	Менеджмент качества
2.2.68	Металлические материалы для крупных транспортных систем
2.2.69	Металловедение высокопрочных сплавов
2.2.70	Методология и практика определения размерных характеристик материалов
2.2.71	Методология научных исследований
2.2.72	Оптические явления в кристаллах. Часть 2
2.2.73	Основы клеточной биологии
2.2.74	Оформление результатов научной деятельности
2.2.75	Практическое применение теории функционала электронной плотности
2.2.76	Симметрия наносистем
2.2.77	Современные компьютерные технологии в структурном анализе
2.2.78	Спектроскопические и зондовые методы
2.2.79	Термомеханическая обработка металлов и сплавов
2.2.80	Управление коллективами
2.2.81	Управление проектами
2.2.82	Химические основы биологических процессов

2.2.83	Цифровое материаловедение
2.2.84	Нормы и правила оформления ВКР
2.2.85	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.86	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.87	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.88	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.89	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.90	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.91	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.92	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, COOTHECEHHЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ОПК-7: Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными документами в соответствующей отрасли

#### Знать:

ОПК-7-33 Нормативную базу в области обработки результатов измерений

ОПК-7-32 Базовые и специальные термины метрологии, стандартизации

ОПК-7-31 Основные требования законодательства РФ в области метрологии и стандартизации

ПК-1: Способен к поиску новых направлений научных исследований и синтезу знаний в области материаловедения и технологии материалов, способен оформлять технические задания и отчетные материалы по планируемым и проведенным исследованиям

#### Знать:

ПК-1-31 Базовые и специальные термины метрологии, стандартизации

ПК-1-34 Правила округления результатов измерений

ПК-1-33 Способы исключения погрешностей

ПК-1-32 Правила и порядок обработки результатов исследований

УК-2: Способен собирать и интерпретировать данные и определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умение обосновывать принятые решения

#### Знать:

УК-2-33 Законы распределения случайных величин

УК-2-32 Способы исключения погрешностей

УК-2-31 Методы и средства измерения физических величин

ОПК-7: Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными документами в соответствующей отрасли

#### Уметь:

ОПК-7-У3 Составлять отчетные материалы по результатам измерений в соответствии с требованиями нормативных документов

ПК-1: Способен к поиску новых направлений научных исследований и синтезу знаний в области материаловедения и технологии материалов, способен оформлять технические задания и отчетные материалы по планируемым и проведенным исследованиям

## Уметь:

ПК-1-У1 Рассчитывать показатели точности измерений с определением всех требующихся в соответствии с текущим законодательство метрологических характеристик.

УК-2: Способен собирать и интерпретировать данные и определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умение обосновывать принятые решения

#### Уметь:

УК-2-У1 Рассчитывать показатели точности измерений с определением всех требующихся в соответствии с текущим законодательство метрологических характеристик.

УК-2-УЗ Выбирать и обосновывать выбор средств измерений.

ПК-1: Способен к поиску новых направлений научных исследований и синтезу знаний в области материаловедения и технологии материалов, способен оформлять технические задания и отчетные материалы по планируемым и проведенным исследованиям

#### Уметь:

ПК-1-У2 Составлять отчетные материалы по результатам измерений в соответствии с требованиями нормативных документов

УК-2: Способен собирать и интерпретировать данные и определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умение обосновывать принятые решения

#### Уметь:

УК-2-У2 Составлять отчетные материалы по результатам измерений в соответствии с требованиями нормативных документов

ОПК-7: Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными документами в соответствующей отрасли

#### Уметь:

ОПК-7-У2 Выбирать и использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке и контроле качества продукции в области электроники

ОПК-7-У1 Применять знания и навыки в области измерений и метрологического обеспечения, в области стандартизации, нормативных документов по метрологи, метрологическому обеспечению и контролю при проведении испытаний в области электроники

ПК-1: Способен к поиску новых направлений научных исследований и синтезу знаний в области материаловедения и технологии материалов, способен оформлять технические задания и отчетные материалы по планируемым и проведенным исследованиям

#### Владеть:

ПК-1-В1 Владеть методами оценивания показателей точности измерений.

УК-2: Способен собирать и интерпретировать данные и определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, умение обосновывать принятые решения

## Владеть:

УК-2-В2 Выбирать и обосновывать выбор методов стандартизации материалов и процессов

УК-2-В1 Владеть методами оценивания показателей точности измерений.

ОПК-7: Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными документами в соответствующей отрасли

#### Владеть:

ОПК-7-В1 Использовать нормативные документы на методики измерений и методы оценивания показателей точности измерений

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ									
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполн яемые работы		
	Раздел 1. Основы метрологии и технических измерений									
1.1	Понятие метрологии. Предмет, задачи, история метрологии. Основные понятия, термины и определения метрологии /Пр/	6	2	ОПК-7-31 ОПК-7-32	Л1.3 Л1.4Л2.1Л3. 1 Э1 Э2		KM1,K M8			

УП: 22.03.01-БМТМ-23\_6-ПП.plx cтр. 7

					·		
1.2	Группы величин. Шкалы измерений /Пр/	6	2	ОПК-7-32	Л1.3 Л1.4Л2.6Л3. 1 Э1 Э2	KM1,K M8	
1.3	Физические величины — размер, значение, единица, размерность. /Пр/	6	2	ОПК-7-32 ОПК-7-У1	Л1.3 Л1.4Л2.6Л3. 1 Э1 Э2	KM2,K M8	
1.4	Международная система единиц. Общие сведения о Государственной системе обеспечения единства измерений. /Пр/	6	2	ОПК-7-31 ОПК-7-32 ОПК-7-У2	Л1.3 Л1.4Л2.6Л3. 1 Э1 Э3	KM2,K M8	
1.5	Воспроизведение и передача размера единиц /Пр/	6	2	ОПК-7-31 ОПК-7-32	Л1.3 Л1.4Л2.6Л3. 1 Э1 Э2	КМ8	
1.6	Эталоны. Государственная поверочная схема и образцовые средства измерений /Пр/	6	2	УК-2-УЗ ОПК -7-З1 ОПК-7- 32 ОПК-7-З3 ОПК-7-У1	Л1.3 Л1.4Л2.3Л3. 1 Э1 Э2	KM8	
1.7	Виды, принципы и методы измерения физических величин. Источники погрешностей измерения физических величин. Классификация погрешностей /Пр/	6	2	УК-2-31 ОПК- 7-32 ОПК-7-33	Л1.3 Л1.4Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э2	KM8,K M3	
1.8	Систематические и случайные погрешности. Способы обнаружения и исключения систематических погрешностей. Случайные погрешности и законы их распределения. Обработка результатов измерений. Требования к оценке измеряемой величины. /Пр/	6	2	УК-2-32 УК-2- 33 ОПК-7-31 ОПК-7-32 ОПК-7-33 ОПК-7-У1 ПК -1-33	Л1.3 Л1.4Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э2	KM3,K M8,KM 4,KM5	
1.9	Точечные и интервальные оценки истинного значения измеряемой величины Обнаружение грубых погрешностей измерения. Правила оформления результатов измерений. Округление результатов измерений. /Пр/	6	2	ОПК-7-31 ОПК-7-32 ОПК-7-33 ОПК-7-У1 ПК -1-31 ПК-1-32 ПК-1-34 ПК-1- У1 ПК-1-У2 ПК-1-В1	Л1.3 Л1.4Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э2	KM4,K M5,KM 8	
1.10	Средства измерений и их классификация. Измерительные сигналы. Погрешности средств измерений и их нормирование. Классы точности средств измерений. Выбор средств измерений для обеспечения требуемой точности результатов измерений. Правила постановки измерительного эксперимента /Пр/	6	2	УК-2-31 ОПК- 7-31 ОПК-7-32 ОПК-7-33 ОПК-7-У1	Л1.3 Л1.4Л2.4Л3. 1 Э1 Э2	KM4,K M8	

1.11	Методы измерения параметров элементов и приборов. Методы измерения оптических и электрофизических параметров материалов, элементов и приборов на основе полупроводниковых и диэлектрических материалов. Требования к методам и анализ погрешностей /Пр/	6	2	УК-2-В1 УК-2 -В2 ПК-1-31	Л1.3 Л1.4Л2.4Л3. 1 Э1 Э2		KM3,K M8	
1.12	Метрологическая аттестация методик выполнения измерений /Пр/	6	2	ОПК-7-31 ОПК-7-У1	Л1.4Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1		KM8	
1.13	Прямые и косвенные измерения /Лаб/	6	6	УК-2-32 УК-2- У1 УК-2-У2 УК-2-В1 ОПК- 7-32 ОПК-7- У1 ОПК-7-В1	Л1.3 Л1.4Л2.4 Л2.5Л3.2 Э1 Э2	Методически е указания по выполнению лабораторно й работы приводятся в в электронном курсе на платформе LMS Canvas		
1.14	Поверка средств измерений /Лаб/	6	5	УК-2-У1 УК-2 -У2 УК-2-В1 ОПК-7-У1 ОПК-7-У2 ОПК-7-У3 ОПК-7-В1	Л1.3 Л1.4Л2.4 Л2.5Л3.2 Э1 Э2	Методически е указания по выполнению лабораторно й работы приводятся в в электронном курсе на платформе LMS Canvas	KM9	P1
1.15	Обработка результатов нескольких серий измерений /Лаб/	6	6	УК-2-32 УК-2- У1 УК-2-У2 УК-2-В1 ОПК- 7-У1 ОПК-7- У3 ОПК-7-В1	Л1.3 Л1.4Л2.4 Л2.5Л3.2 Э1 Э2	Методически е указания по выполнению лабораторно й работы приводятся в в электронном курсе на платформе LMS Canvas	KM11	P3
1.16	Подготовка к практическим занятиям /Ср/	6	42	УК-2-31 УК-2- 32 ОПК-7-31 ОПК-7-32	Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э2 Э3		KM1,K M2,KM 3,KM4, KM5	

1.17	Обработка результатов и подготовка к защите лабораторных работ /Ср/	6	36	УК-2-У1 УК-2 -У2 УК-2-В1 ОПК-7-У1 ОПК-7-У3 ОПК-7-В1	Л1.3 Л1.4Л3.2 Э1 Э2	Методически е указания по выполнению лабораторно й работы приводятся в в электронном курсе на платформе LMS Canvas	KM11,K M9,KM 10	
	Раздел 2. Основы стандартизации							
2.1	Закон о техническом регулировании. Принципы технического регулирования. Технические регламенты. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента. /Пр/	6	2	ОПК-7-31 ОПК-7-32 ОПК-7-У1	Л1.1 Л1.2Л2.2Л3. 1 Э1 Э2		KM6,K M8	
2.2	Сущность стандартизации. Цели и, принципы стандартизации. Объекты стандартизации. Нормативные документы по стандартизации. Методы стандартизации /Пр/	6	2	ОПК-7-31 ОПК-7-32	Л1.1 Л1.2Л2.7Л3. 1 Э1 Э2 Э5		KM6,K M8	
2.3	Государственная система стандартизации. Общая характеристика системы ГСС. Органы и службы стандартизации. Категории и виды стандартов. Характеристики стандартов разных категорий. Порядок разработки стандартов /Пр/	6	2	ОПК-7-31 ОПК-7-32	Л1.1 Л1.2Л2.7Л3. 1 Э1 Э2 Э5		KM6,K M8	
2.4	Межгосударственная, международная и региональная стандартизация. Международные организации по стандартизации. Применение международных стандартов. Гармонизация в стандартизации /Пр/	6	2	ОПК-7-32 ОПК-7-У1	Л1.1 Л1.2Л2.7Л3. 1 Э1		KM8	
2.5	Межотраслевые системы стандартов. Стандарты в области качества. Стандарты по управлению и информации. Классификация и кодирование продукции /Пр/	6	2	ОПК-7-32 ОПК-7-У1	Л1.1 Л1.2Л2.7Л3. 1 Э1		KM7,K M8	
2.6	Подготовка к практическим занятиям /Ср/	6	15	УК-2-В2 ОПК- 7-31 ОПК-7-32	Л1.1 Л1.2Л2.2Л3. 1 Э1 Э2 Э4 Э5		KM7,K M6	

# 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки						
Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки				
KM1	Тест 1	ОПК-7-31;ОПК-7- 32;ОПК-7-33	1) Понятие «метрология», место метрологии в системе наук. 2) Основные разделы метрологии, их задачи. 3) Понятия «измерение», «физическая величина», «единство измерений». 4) Оцениваемые и измеряемые физические величины (ФВ), размер ФВ, числовое значение ФВ, значение ФВ, единица ФВ, основное уравнение измерений. 5) Виды физических величин. Примеры. 6) Шкалы измерений. Примеры.				
KM2	Тест 2	ОПК-7-31;ОПК-7- 32;ОПК-7-У1;ОПК- 7-33	1) Размерность физической величины. Примеры. 2) Система физических величин. Основные и производные ФВ. 3) Системные, внесистемные, кратные и дольные физические величины. 4) Международная система единиц СИ. 5) Государственная система обеспечения единства измерений.				
КМ3	Тест 3	ОПК-7-31;ОПК-7- 32	Классификация измерений.				
KM4	Тест 4	ОПК-7-31;ОПК-7- 32;ОПК-7-У1;УК-2 -32;УК-2-У1;УК-2- У2;УК-2-В1;ОПК-7 -33;УК-2-33	<ol> <li>Классификация погрешностей.</li> <li>Способы исключения погрешностей.</li> <li>Обработка результатов однократных измерений.</li> </ol>				
KM5	Тест 5	ОПК-7-31;ОПК-7- 32;ОПК-7-У1;УК-2 -32;УК-2-У1;УК-2- У2;УК-2-В1;УК-2- 33	<ol> <li>Классификация погрешностей.</li> <li>Способы исключения погрешностей.</li> <li>Обработка результатов многократных измерений.</li> </ol>				
KM6	Тест 6 (Стандартизация)	ОПК-7-31;ОПК-7- 32;ОПК-7-У1;ОПК- 7-33;УК-2-В2	1) Стандартизация, цели и принципы стандартизации. 2) Международные организации по стандартизации. 3) Методы стандартизации. 4) Объекты стандартизации, документы по стандартизации. 5) Понятие унификации и агрегатирования. 6) Комплексная и опережающая стандартизация.				
KM7	Тест 7 (СМК)	ОПК-7-У2;УК-2- В2;ОПК-7-32	Стандарты ISO серии 9000				

KM8	Итоговый тест по курсу	ОПК-7-31;ОПК-7- 32;УК-2-31;УК-2- 32;УК-2-У1;УК-2- В1;ОПК-7-33;ОПК- 7-У1;УК-2-33;УК-2 -У3;УК-2-В2	1) Понятие «метрология», место метрологии в системе наук. 2) Основные разделы метрологии, их задачи. 3) Понятия «измерение», «физическая величина», «единство измерений». 4) Оцениваемые и измеряемые физические величины (ФВ), размер ФВ, числовое значение ФВ, значение ФВ, единица ФВ, основное уравнение измерений. 5) Виды физических величин. Примеры. 6) Шкалы измерений. Примеры. 7) Размерность физической величины. Примеры. 8) Система физических величин. Основные и производные ФВ. 9) Системные, внесистемные, кратные и дольные физические величины. 10) Международная система единиц СИ. 11) Государственная система обеспечения единства измерений. 12) Воспроизведение единицы физической величины, передача размеров ФВ, хранение ФВ. 13) Эталоны единиц ФВ. 14) Поверочная схема. Поверка средств измерений. 15) Классификация измерений. 16) Понятие контроля и испытаний. 17) Основные характеристики измерений. 20) Понятия истинного и действительного значения физической величины. 21) Факторы, приводящие к возникновению погрешностей. 22) Классификация погрешностей. 23) Способы исключения погрешностей. 24) Алгоритм обработки результатов измерений. 25) Правила округления результатов измерений. 26) Средства измерений, их классификация и классы точности. 27) Стандартизация, цели и принципы стандартизации. 28) Международные организации по стандартизации. 29) Методы стандартизации, документы по стандартизации. 30) Объекты стандартизации, документы по стандартизации. 31) Попятие унификации и агрегатирования. 32) Комплексная и опережающая стандартизация.
KM9	Защита лабораторной работы "Поверка средств измерений"	ОПК-7-У1;УК-2- 31;УК-2-32;УК-2- У1;УК-2-У2;УК-2- В1;ОПК-7-31;ОПК- 7-32;ОПК-7- 33;ОПК-7-У2;ОПК- 7-У3;ОПК-7-В1;УК -2-33;УК-2-У3	Тосударственная система обеспечения единства измерений.     Воспроизведение единицы физической величины, передача размеров ФВ, хранение ФВ.     Эталоны единиц ФВ.     Поверочная схема. Поверка средств измерений.
KM10	Защита лабораторной работы "Прямые и косвенные измерения"	ОПК-7-32;ОПК-7- У1;ОПК-7-У3;ОПК -7-В1;УК-2-31;УК- 2-32;УК-2-У1;УК-2 -У2;УК-2-В1;ОПК- 7-31;ОПК-7- 33;ОПК-7-У2;УК-2 -33	1) Классификация измерений. 2) Методы измерений. 3) Источники погрешностей измерений. 4) Факторы, приводящие к возникновению погрешностей. 5) Классификация погрешностей. 6) Способы исключения погрешностей. 7) Алгоритм обработки результатов измерений. 8) Правила округления результатов измерений.
KM11	Защита лабораторной работы "Обработка результатов нескольких серий измерений"	ОПК-7-32;ОПК-7- У1;ОПК-7-У3;ОПК -7-В1;УК-2-32;УК- 2-У1;УК-2-У2;УК-2 -В1;ОПК-7-31;ОПК -7-33;ОПК-7- У2;УК-2-31;УК-2- 33	1) Классификация измерений. 2) Методы измерений. 3) Источники погрешностей измерений. 4) Факторы, приводящие к возникновению погрешностей. 5) Классификация погрешностей. 6) Способы исключения погрешностей. 7) Алгоритм обработки результатов измерений. 8) Правила округления результатов измерений. Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)
C.Z. Hepe	Pago 1, philomina	1	
Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы

УП: 22.03.01-БМТМ-23\_6-ПП.plx стр. 12

P1	Лабораторная	ОПК-7-У1;ОПК-7-	Методические указания по выполнению лабораторной работы
	работа "Поверка	У3;ОПК-7-В1;УК-2	приводятся в электронном курсе на платформе LMS Canvas
	средств измерений"	-31;УК-2-32;УК-2-	
		У1;УК-2-У2;УК-2-	
		В1;ОПК-7-31;ОПК-	
		7-32;ОПК-7-	
		33;ОПК-7-У2;УК-2	
		-33;УК-2-У3	
P2	Лабораторная	ОПК-7-32;ОПК-7-	Методические указания по выполнению лабораторной работы
	работа "Прямые и	У1;ОПК-7-У3;ОПК	приводятся в электронном курсе на платформе LMS Canvas
	косвенные	-7-В1;УК-2-31;УК-	
	измерения"	2-32;УК-2-У1;УК-2	
		-У2;УК-2-В1;ОПК-	
		7-31;ОПК-7-	
		33;ОПК-7-У2;УК-2	
		-33	
P3	Лабораторная	ОПК-7-У1;ОПК-7-	Методические указания по выполнению лабораторной работы
	работа "Обработка	У3;ОПК-7-В1;УК-2	приводятся в электронном курсе на платформе LMS Canvas
	результатов	-32;УК-2-У1;УК-2-	
	нескольких серий	У2;УК-2-В1;УК-2-	
	измерений"	33;ОПК-7-31;ОПК-	
		7-32;ОПК-7-33	

# 5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

экзамен не предусмотрен

# 5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

По курсу предусмотрен зачет с оценкой.

Обучающийся получает оценку за зачет на основании средней оценки по промежуточным тестам, выполняемым в течении семестра с целью оценки освоения пройденного материала, при учете прохождения всех предусмотренных тестирований и успешной защиты лабораторных работ

Результат прохождения теста рассчитывается как процент правильно выполненных заданий.

Шкала оценивания знаний обучающихся на зачете:

Оценка «отлично» - 90 - 100 %

Оценка «хорошо» - 75 - 89 %

Оценка «удовлетворительно» - 50 - 74 %

Оценка «неудовлетворительно» - до 50 %

Оценка «не явка» – обучающийся на зачет не явился.

	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ							
	6.1. Рекомендуемая литература							
6.1.1. Основная литература								
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год				
Л1.1	Дерюшева Т. В.	Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебное пособие	Электронная библиотека	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011				
Л1.2	Ширялкин А. Ф.	Стандартизация и техническое регулирование: учебно-практическое пособие: учебное пособие	Электронная библиотека	Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), 2013				
Л1.3	Мозгова Г. В., Савенков А. П., Дивин А. Г., Пономарев С. В., Шишкина Г. В.	Метрология и технические измерения: учебное электронное издание: учебное пособие	Электронная библиотека	Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018				
Л1.4	Сигов А. С., Нефедов В. И., Сигов А. С.	Метрология, стандартизация и технические измерения: учебник для студ. вузов	Библиотека МИСиС	М.: Высш. шк., 2008				
		6.1.2. Дополните	льная литература					
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год				

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год		
Л2.1	Петрушевский Ф. И.	Краткая европейская	Электронная библиотека	Санкт-Петербург:		
012.1	Trespy mederalit 4:11.	метрология или описание		Типография Эдуарда Праца и		
		главных мер, весов и монет в		K°, 1845		
		Европе ныне употребляемых				
Л2.2	Колышкин А. Е.	Техническое регулирование.	Электронная библиотека	Москва: Академия		
		Основные положения: учебное пособие		стандартизации, метрологии и сертификации, 2009		
Л2.3	Дресвянников А. Ф.,	Эталоны физических	Электронная библиотека	Казань: Казанский		
312.3	Ситников С. Ю.,	величин: учебное пособие	электронная ополнотска	национальный		
	Сорокина И. Д.			исследовательский		
				технологический		
				университет (КНИТУ), 2013		
Л2.4	Богомолов Ю. А., Медовикова Н. Я.	Оценивание погрешностей	Электронная библиотека	Москва: Академия		
	медовикова п. л.	измерений: курс лекций		стандартизации, метрологии и сертификации, 2013		
Л2.5	Шклярова Е. И.	Погрешности измерений.	Электронная библиотека	Москва: Альтаир МГАВТ,		
		Обработка результатов		2009		
		однократных и многократных измерений: учебное пособие				
Л2.6	Бастраков В. М.	Метрология: учебное	Электронная библиотека	Йошкар-Ола: Поволжский		
312.0	Bue Tpunob B. IVI.	пособие	электронная ополнотека	государственный		
				технологический		
				университет, 2016		
Л2.7	Тарасова О. Г.	Стандартизация и	Электронная библиотека	Йошкар-Ола: Поволжский		
		подтверждение соответствия		государственный технологический		
		продукции и услуг: учебное пособие		университет, 2018		
		1		универентет, 2010		
	Apropii gographizatii	Заглавие	Библиотека	Из поточнотро, год		
П2 1	Авторы, составители			Издательство, год Йошкар-Ола: Поволжский		
Л3.1	Тарасова О. Г., Цветкова Е. М.	Метрология, стандартизация и подтверждение	Электронная библиотека	государственный		
	Цветкова В. 141.	соответствия продукции и		технологический		
		услуг: практикум		университет, 2017		
Л3.2	Коминов Сергей Викторович	Метрология, технические измерения и приборы: лаб. практикум	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2010		
	6.2. Переч	ень ресурсов информационно-	 -телекоммуникационной сети	«Интернет»		
n.	Метрология, стандарти	изация и технические	https://lms.misis.ru			
Э1	измерения					
		МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И		http://micromake.ru/old/msisbook/msisoglav.htm		
Э2	СЕРТИФИКАЦИЯ. Уч	лебное пособие. В.И.				
	Колчков. 2015 ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин		1.4//			
Э3			http://gostrf.com/normadata/1/4294845/4294845105.pdf			
Э4	Консультант+	егулировании. Система	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241			
Э5	Федеральный закон "О Система Консультант+		http://www.consultant.ru/docum	ent/cons_doc_LAW_181810/		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		аммного обеспечения			
П.1	LMS Canvas					
П.2	Microsoft Office					
П.3	Консультант Плюс					
П.4	Garant.ru					
П.5		MS Teams				
		ь информационных справочн				
И.1	https://lms.misis.ru Система управления обучением с открытым исходным кодом LMS Canvas					
И.2	http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система Консультант плюс					
И.3		http://www.garant.ru Справочно-правовая система				
И.4	http://www.gostinfo.ru Официальный сайт Российского научно-технического центра информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия					

И.5	https://www.rst.gov.ru/portal/gost Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) - каталог национальных стандартов, межгосударственных стандартов, стандартов ISO	
И.6	http://www.gostinfo.ru Официальный сайт Российского научно-технического центра информации по	
	стандартизации, метрологии и оценке соответствия	

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ						
Ауд.	Назначение	Оснащение				
Любой корпус Мультимедийная	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и/или для проведения практических занятий:	комплект учебной мебели до 36 мест для обучающихся, мультимедийное оборудование, магнитно-маркерная доска, рабочее место преподавателя, ПКс доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus				
K-416	Лаборатория	спектрофотометр «Cary-5000» UV-VIS-NIR фирмы «Varian», с ПК и лицензионным ПО; испытательный комплекс ИК-ЭОЭ-1; инструментальный микроскоп ИМЦ 100х50А; гониометр-спектрометр ГС-2; интерферометр типа Физо ИФ-77 с ПК; микротвердомер «Aaffri DM 8» В AUTO с ПК и лицензионным ПО; микроскоп Carl Zeiss «Axio Imager» М1m с ПК и лицензионным ПО; испытательный комплекс для исследования электрофизических параметров материалов и их температурных зависимостей				
Читальный зал электронных ресурсов		комплект учебной мебели на 55 мест для обучающихся, 50 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus.				

# 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

При конспектировании информации на практических занятиях в конспект следует заносить всё, что рекомендует преподаватель. Изучение и отработка прослушанного материала без промедления значительно экономят время и способствует лучшему усвоению материала.

Студентам рекомендуется с самого начала освоения данного курса работать с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

Самостоятельная работа студентов организуется и контролируется путем индивидуального опроса студентов во время практических и лабораторных занятий, проведения тестов по темам курса.

При освоении данного курса студент должен пользоваться библиотекой вуза, а также электронными базами учебной литературы, в соответствии с настоящей программой